

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー

IoT・5G 向け実装基板の HALT (高加速限界試験) による 信頼性向上技術の動向

ーバウンダリスキャン(JTAG)テストとの併用ー

開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構

協力：石川県工業試験場

電子機器の小型化と高性能化に伴い、BGA 部品のパッケージは、これまでの 1.27mm ボールピッチがから 0.5mm へと狭くなっています。これに伴い BGA パッケージが実装された基板の不良が増加する傾向にあります。しかし、従来のプローブを端子に当てる ICT や外観検査装置で実装不良を検出できない場合、断面観察等が必要となり、時間を要してしまうことが課題です。そこで高密度実装の信頼性向上のために考案された新しいテスト手法である JTAG (Joint Test Action Group) による信頼性評価事例について紹介します。多数ご参加くださいますようお願い致します。

[日 時] 令和4年2月7日 (月) 13:30~15:00

[形 式] Webex による Web 配信【お申込みされた e-mail に URL を送信します】

[講 師] アンドールシステムサポート株式会社

谷口 正純 氏

エスペック株式会社

今堀 翔也 氏

[受講料] 無料

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 電子情報部 専門研究員 的場 彰成

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地 (石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 令和4年1月31日 (月) (定員になり次第締切ります)

ー 受講ご希望の方は下記に記入し、e-mail、FAX で、または QR コードよりお申込み下さい ー

石川県次世代産業育成講座：

「IoT・5G 向け実装基板の HALT (高加速限界試験) による信頼性向上技術の動向」

日 時：令和4年2月7日 (月) 13:30~15:00

形 式：Webex による Web 配信【お申込みされた e-mail に URL を送信します】

会 社 名

住 所(〒)

電話

FAX



所 属	氏 名	e-mail